



展示会のご案内

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社は2018年11月1日(木)から6日(火)の6日間、東京ビッグサイトで開催される「第29回 日本国際工作機械見本市 JIMTOF2018」において、「ものづくりの未来を切り開く、ACCRETECH東京精密」をテーマに出展いたします。

JIMTOF2018では、新型センサを搭載した高精度三次元座標測定機や世界最高クラスの超高精度真円度・円筒形状測定機など、数々の新製品を展示するとともに、新たな分野であるX線CT装置も今回初出展いたします。また、AIやIoT化に伴う市場ニーズへの対応として、省人化や高効率化をテーマとしたゾーンや産業用自動化をテーマにした展示もいたします。是非、この機会に弊社ブースまで足をお運びいただきますようお願い申し上げます。

弊社は、総合精密測定機器メーカーとして、常にお客様の満足を目標に、高品質の製品で、ものづくりをお手伝いしてまいります。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

敬具

2018年 9月 吉日

株式会社東京精密

代表取締役社長CEO 吉田 均

JIMTOF2018
第29回 日本国際工作機械見本市

ACCRETECH
株式会社東京精密

I n v i t a t i o n

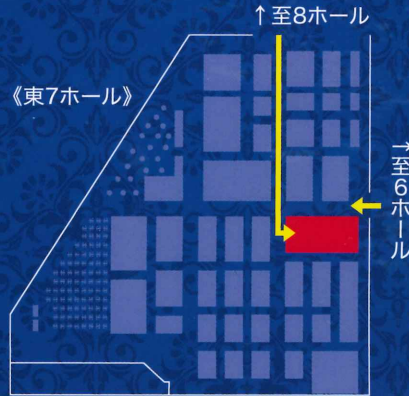
JIMTOF 2018

第29回 日本国際工作機械見本市

開催場所 東京ビックサイト(東京国際展示場) 東7ホール E7032
 開催日時 2018年11月1日(木)~6日(火) 9:00~17:00

東京精密は東7ホールでの出展となります。
 皆様のご来場をお待ち申し上げます。

《会場MAP》



株式会社東京精密 《東7ホール》E7032

《ブース内 出展エリア》

- 初出展・新製品エリア
- 自動化エリア (協働・省人化・高効率)
- プレゼンテーションエリア
- 小型計測機体験エリア
- 光計測エリア
- 自動計測エリア
- 三次元エリア



NEW
 Dimensional X線 CT装置
ZEISS METROTOM
 X線CTソリューションの導入による
 工業プロセス全体の効率性と透明性の追求



直感操作型表面粗さ測定機
SURFCOM TOUCH 35,50,550
 シンプルかつ簡単操作
 使いやすさを徹底的に追求した小型タイプの
 グローバルスタンダード



高精度三次元座標測定機
AXCEL
 高精度、高速、高耐環境性と
 多彩なプローブシステムを
 兼ね備えた 三次元座標測定機の
 グローバルスタンダード



NEW
 超高精度真円度・円筒形状測定機
RONDCOM CREST
 全てが革新的。東京精密の超高精度
 フラッグシップモデル



光学測定機器
Opt-scope R
 機械加工部品の表面粗さ・
 形状を非接触で短時間に測定

ATC用内径測定ヘッド
無線ボアゲージ
 高精度穴径測定やマシニングセンタでの
 機内測定が可能

アルミ高速切削加工監視装置
ATC 振れ検出システム
 ツールテーパー部及び端面への切粉の噛み込みを検知し、
 加工不良を防止



その他にも、省人化、高効率化の提案や産業用自動化をテーマに実機を多数展示いたします。

ワークショップのご案内

下記日時にて、ワークショップを開催いたします。是非ご参加ください。

日時 2018年11月 3日(土) 15:00~16:00

会場 会議棟 6F - 605会議室

■受講のお申込みは、同封の申し込み書をFAXまたはメールにてお願いいたします。
 その他、ご質問等ありましたら各担当エリア営業までお問い合わせください。

超高精度フラッグシップモデル 真円度・円筒形状測定機のご紹介

講師：森井秀樹

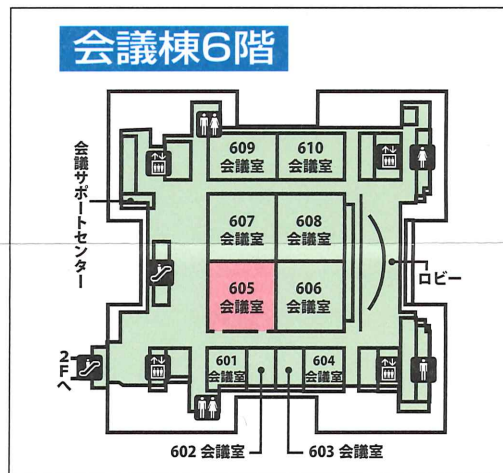
世界最高クラスの回転精度を誇り、超精密部品の測定に特化した超高精度
 真円度・円筒形状測定機の仕様・技術をご紹介します。

ACCRETECH 東京精密 出展社ワークショップ開催のお知らせ

世界最高クラスの回転精度を誇り、超精密部品の測定に特化した超高精度真円度・円筒形状測定機の仕様・技術をご紹介します。

受講をご希望の方は、下記申込書に必要事項をご記入のうえ、弊社までFAXもしくはメールにてお申込みください。

- 開催日時 2018年 11月3日(土) 午後3時00分～午後4時00分
- 開催場所 東京ビッグサイト 会議棟6階 605会議室
〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1
りんかい線「国際展示場」駅下車 徒歩約7分
ゆりかもめ「国際展示場正門」駅下車 徒歩約3分
- 参加人数 最大120名
- 参加費 無料
- タイトル 超高精度フラッグシップモデル
真円度・円筒形状測定機のご紹介
- 講師 Surface & Form Group 森井 秀樹
- お問い合わせ TEL: **029-831-1234(代)**



JIMTOF2018 出展者ワークショップ申込書

必要事項をご記入のうえ、FAXもしくはメールにてお申込みください。

お申込みの方には、弊社より『参加お申込み受付票』をお送りいたします(当日ご持参ください)。

お申込み代表者

貴社名	
お名前(フリガナ)	(フリガナ)
〒ご住所	
所属部署	
お役職名	
電話番号	
メールアドレス	

受講者

	お名前	所属部署	お役職名
1			
2			
3			
4			
5			

※希望者多数の場合は調整させていただく場合がございます。予めご了承ください。

FAX もしくはメールにてお申込みください

FAX:029-831-6676 もしくは e-mail: techsales.metrology@accretech.jp

※個人情報保護法等の関連諸法令を遵守し、個人情報保護ガイドラインに基いて適切に保護して取り扱います。
※ご記入いただいた個人情報は、本セミナーの運営・事務手続き、ならびに今後の製品サービスのご案内等に使用させていただきます。

JIMTOF 2018 精密測定機器活用セミナー

- ・開催日時／2018年11月5日(月) 午前10時00分～午後4時30分
 - ・開催場所／東京ビッグサイト 会議棟1階 101会議室 (〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1)
 - ・参加人数／最大120名 ・参加費／無料 ・お申し込み期限／10月31日
- ※お申し込み期限以降のキャンセルはご遠慮ください。その場合、テキスト代として2,000円を申し受けます。代理の方のご出席をお願いします。

概要

第一部 精密計測の基本技術

時間	セッション名	講演者
10:00 ～ 10:45 (45分)	測定不確かさ －ブロックゲージの比較校正を事例として－	国立研究開発法人産業技術総合研究所 工学計測標準研究部門長さ標準研究グループ グループ長 尾藤 洋一 氏
10:45 ～ 11:30 (45分)	表面性状評価における基本技術 －線から面まで－	公立大学法人首都大学東京 東京都立産業技術高等専門学校 ものづくり工学科 生産システム工学コース 教授 深津 拓也 氏
11:30 ～ 12:15 (45分)	先進加工計測の技術動向 －ナノ製造基盤への展開－	大阪大学 大学院工学研究科 教授 高谷 裕浩 氏

第二部 計測技術動向と活用

時間	セッション名	講演者
13:15 ～ 14:00 (45分)	CMMの技術動向 －多数点群によるCMMの性能評価法の国際標準化にむけて－	国立研究開発法人産業技術総合研究所 工学計測標準研究部門幾何標準研究グループ グループ長 阿部 誠 氏
14:00 ～ 14:30 (30分)	JEITA三次元CAD情報標準化 専門委員会 活用・実証分科会活動紹介 －設計～製造/検査まで、Totalの効率化と品質の担保/向上－	富士ゼロックス株式会社 CS品質本部 品質保証部 マネージャ 重田 国啓 氏
14:30 ～ 15:00 (30分)	現場環境における三次元測定機の高度化 －直角誤差補正および回転式プロービングシステムの評価－	地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 多摩テクノプラザ 電子・機械グループ 主任研究員 大西 徹 氏

第三部 三次元座標測定機の活用ヒント

時間	セッション名	講演者
15:10 ～ 15:35 (25分)	三次元測定機における座標系の考え方 －実際の運用を考慮した座標系の設定方法について－	石川県工業試験場 機械金属部 専門研究員 根田 崇史 氏
15:35 ～ 16:00 (25分)	プロービング圧の変化による測定精度への影響 －プロービング圧とスタイラスサイズの変更による測定結果の違い－	地方独立行政法人 山口県産業技術センター 企業支援部 加工技術グループ 専門研究員 永田 正道 氏
16:00 ～ 16:25 (25分)	画像測定機の照明光量と形状測定値の関係 －推奨光量で測定すれば大丈夫？－	国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 幾何標準研究グループ 主任研究員 鍛島 麻理子 氏

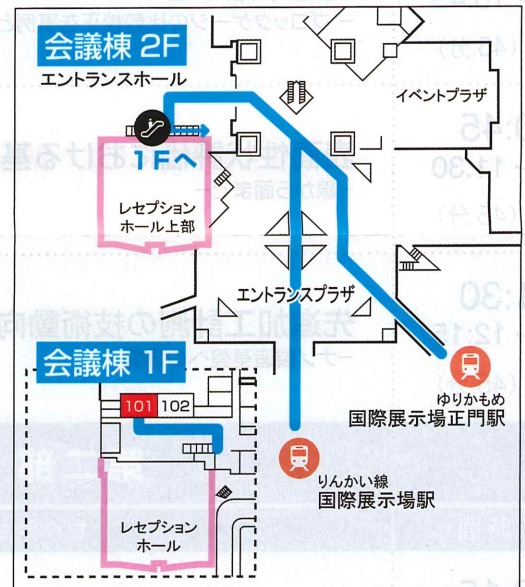
JIMTOF 2018 精密測定機器活用セミナーのご案内

主催 日本精密測定機器工業会
 合同技術委員会
 三次元測定機部会

日本のものづくり産業においては精密測定機器の普及が進んでいるものの、産業層やアプリケーションによってはそれらが活用されていない領域があります。また、IATF16949の発行等により、その測定管理の重要性が増えています。そういった背景をもとに精密測定機器の有効性を示すことで更なる普及を図り、日本のものづくり産業の活性化に寄与するため、本セミナーを企画いたしました。

受講をご希望の方は、次頁申込書に必要事項をご記入の上、当工業会までお申込みください。

- 開催日時** 2018年11月5日(月) 午前10時00分～午後4時30分
- 開催場所** 東京ビッグサイト 会議棟1階 101会議室
 〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1
 りんかい線「国際展示場」駅下車 徒歩約7分
 ゆりかもめ「国際展示場正門」駅下車 徒歩約3分
- 参加人数** 定員120名(定員となり次第、締め切らせて戴きます)
- 参加費** 無料
- プログラム** 詳細は裏面をご覧ください。
 10:00～12:15 第一部 精密計測の基本技術
 13:15～15:00 第二部 計測技術動向と活用
 15:10～16:30 第三部 三次元座標測定機の活用ヒント



お問い合わせ 日本精密測定機器工業会
TEL: 03-3434-9557
E-mail: info@jpmia.gr.jp

JIMTOF2018 精密測定機器活用セミナー申込書

下記に必要事項をご記入いただき、お申し込みください。
 お申し込みをいただいた方には、当工業会より『参加お申し込み受付票』をお送りいたします。

お申込み代表者	貴社名	
	お名前(フリガナ)	(フリガナ)
	〒ご住所	
	所属部署	
	お役職名	
	TELおよびFAX (TEL)	(FAX)
メールアドレス		

※受講者全員のお名前をご記入ください。

	お名前	所属部署	お役職名	参加希望セッション
受講者	1			1・2・3
	2			1・2・3
	3			1・2・3
	4			1・2・3
	5			1・2・3

※下記のセッション名から、参加を希望されるセッション番号に○をつけてください。(複数選択可)
 ※受講者多数の際は調整させていただく場合がございます。予めご了承ください。

セッション名	1 精密計測の基本技術 2 計測技術動向と活用 3 三次元座標測定機の活用ヒント
---------------	--

お申込みは下記まで

FAX: 03-3434-1695 または e-mail: info@jpmia.gr.jp

※個人情報保護法等の関連諸法令を遵守し、個人情報保護ガイドラインにしたがって適切に保護して取り扱います。※ご記入いただいた個人情報は、本セミナーの運営・事務手続き、ならびに今後の当工業会主催の催しのご案内等に使用させていただく場合がございます。